

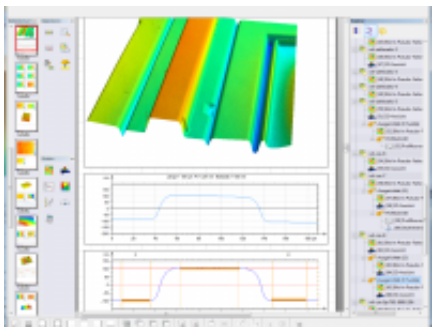
Mikroskope



Mess- und Inspektionsmikroskope in verschiedener Ausstattung für Halbleiter / MEMS Applikationen. Höchste optische Leistungsfähigkeit, schnelle einfache Bedienung.

[Mehr Informationen](#)

Software MCS



Modulare Softwaresuite MCS:

- Inspektion
- Review
- Metrology (CD, Konfokal,...)
- Hardwaresteuerung

[Mehr Informationen](#)

Inspection&Metrology



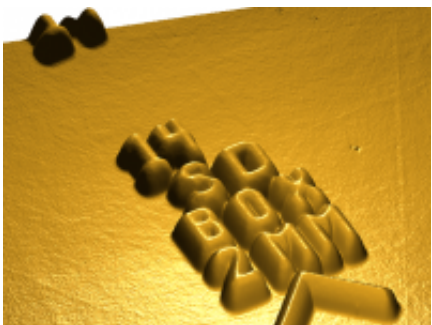
PROMIS

Promicron Inspektions & Metrologie Systeme

- vollautomatisch
- flexibel nutzbar
- für Inspektion und Metrologie

[Mehr Informationen](#)

Weisslichtinterferenz

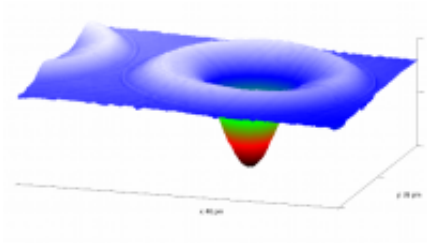


PRO-WLI

Mikroskopausrüstung auf Basis INM200/Ergoplan oder DM8000 mit Interferometer-Hardware & Software zur Vermessung der Topographie sowie zum Export der 3D Daten.

[Mehr Informationen](#)

Konfokal Mikroskopie



PRO-CON

Mikroskop-Konfokalm modul als Upgrade für hochauflösende 3D Metrology.

[Mehr Informationen](#)

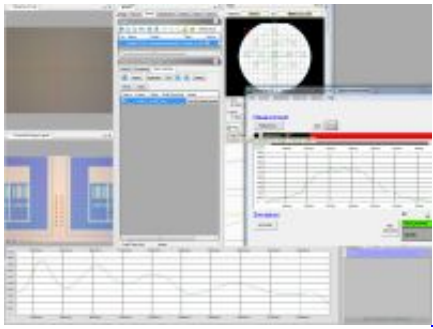
Leica DM8000



Inspektionsmikroskop Leica DM8000 MCS. Modifiziertes Mikroskop für VIS und IR Inspektion im Auflicht und Durchlicht. Software zur halbautomatischen Wafer & MEMS Inspektion.

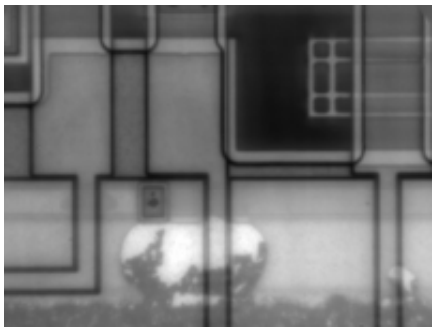
[Mehr Informationen](#)

Thin Film Measuring



[Mehr Informationen](#)

Infrared Systems



[Mehr Informationen](#)